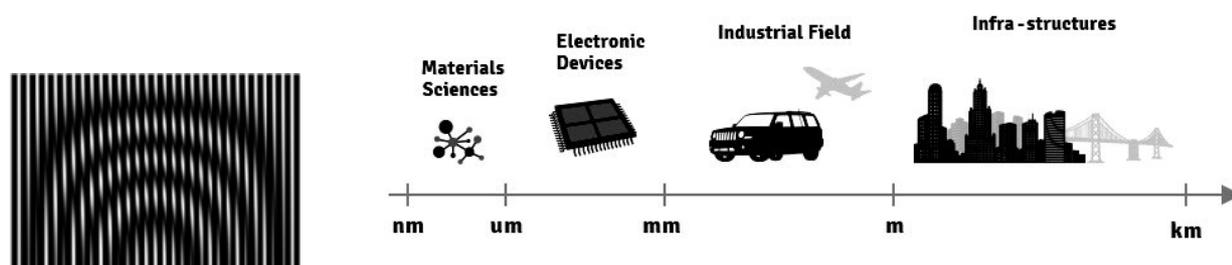


「第4回サンプリングモアレ法による構造物の計測技術に関する研究会」 開催のご案内

画像を用いて構造物の変位分布を計測する手法のひとつに「サンプリングモアレ法」があります。この手法は2次元格子の位相を解析することで、精度よく2次元の変位が計測できるというものです。少し工夫をすることで3次元の変位分布を求めたり、たわみ角を求めることも可能です。また、ハードウェア化することでリアルタイムに変位分布を計測することもできます。大型構造物の検査への適用や三次元計測への応用など、実用化をめざした取り組みも行われています。また、微細構造や生体計測への応用なども行われています。本研究会では、この手法を構造物の計測に適用する技術について情報交換を行います。



日時：2017年10月14日（土） 9:30~17:15

場所： 上野・いいオフィス 3F（上野駅・徒歩2分）

<https://iioffice.liginc.co.jp/access>

参加費：一般2000円，主催・後援団体所属1000円，学生無料

主催：日本実験力学学会光学的手法分科会，全空間画像計測コンソーシアム

後援：産業技術総合研究所

HP: <http://ws-conso.com/index.html>

https://staff.aist.go.jp/ri-shien/activity/event/171014_SM-seminar_Ueno.html

プログラム（案）

1. 開催挨拶 9:30（藤垣・李）

2. 研究発表

座長（産総研 李志遠） 9:35~10:00

（S01：9:35-10:00）

サンプリングモアレ法の発展と社会インフラへの応用例

福井大学 ○ 藤垣 元治

（S02：10:00-10:25）

サンプリングモアレカメラを用いた鉄道橋の計測データの活用法に関する提案

ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 ○ 栗林 賢一，京都大学 松本理佐，服部篤史，福井大学 藤垣元治，京都大学 河野広隆

（S03：10:25-10:50）

サンプリングモアレカメラの適用事例

株式会社共和電業 ○ 津田 仁，前田 芳巳，立野 恵一

(S04 : 10:50-11:15)

サンプリングモアレカメラの開発と今後の展開

株式会社ヒカリ ○ 浅井 大介

休憩 11:15~11:20

(S05 : 11:20-11:55)

サンプリングモアレ法を用いた開水路乱流の水面変動計測 (20分)

神戸大学 ○ 谷 昂二郎, 藤田 一郎

(S06 : 11:55-12:20)

1ピッチ位相解析(OPPA)法による高精度・高速三次元形状変形計測と装置開発

株式会社4Dセンサ ○ 森本 吉春

(D01 : 12:20-12:40)

高精度・高速三次元形状変形計測装置のデモ (4Dセンサ)

昼休憩 12:40~13:30

座長 (福井大学 藤垣 元治) 13:30~14:50

(S07 : 13:30-13:55)

薄膜の積層による金二重ナノピラー配列の作製とその光学特性

東京農工大学 ○ 久保 若奈

(S08 : 13:55-14:20)

Displacement and Strain Measurement for Crack Prediction and Structure Health Monitoring

AIST ○ Qinghua Wang, Shien Ri, Hiroshi Tsuda

(S09 : 14:20-14:45)

2次元位相シフト法による高精度・高速な縞画像の位相解析

(国) 産業技術総合研究所 ○ 李志遠, 王慶華, 夏鵬, 津田 浩

休憩 14:45~15:00

座長 (株式会社4Dセンサ 森本 吉春) 15:00~16:15

(S10 : 15:00-15:25)

ナノオーダー面外変形動的計測方法

(国) 産業技術総合研究所 ○ 夏鵬, 王慶華, 李志遠, 津田 浩

(S11 : 15:25-15:50)

固体ロケット構造体診断技術と3次元モアレカメラ計測システムの開発

IHI エアロスペース ○ 吉田 剛, 梅林 孝, 佐藤 明良

産業技術総合研究所 李志遠, 津田 浩

JAXA 佐藤 英一

ヒカリ 浅井 大介

(S12 : 15:50-16:15)

サンプリングモアレ法による GaN デバイス中の原子サイズ欠陥・歪の検出

東芝デバイス&ストレージ 小寺雅子、吉岡啓、杉山亨、浜本毅司、宮下直人
産業技術総合研究所 王慶華、李志遠、津田浩

座長 (産総研 李 志遠) 16:15~17:00 学生セッション (発表時間は 15 分)

(S13 : 16:15-16:30) CFRP 積層板を用いた光学顕微鏡下でのひずみ分布計測方法

東京理科大学 ○ 高下 陽右, 喜多村 竜太, 荻原 慎二
(国) 産業技術総合研究所 王 慶華, 李 志遠, 津田 浩

(S14 : 16:30-16:45) サンプリングモアレ法による変位・回転角計測におけるゆらぎの検証

福井大学 ○ 仙波 悠生, 中嶋 友朗, 黒川 覚, 藤垣 元治

(S15 : 16:45-17:00) 規則模様を用いた広レンジな光学的変位計測方法

東京理科大学 ○ 長澤 佑樹, 喜多村 竜太, 荻原 慎二
(国) 産業技術総合研究所 李 志遠, 津田 浩

3. 全体フリーディスカッション (10 分程度)

4. 閉会の挨拶 (17:15 終了予定)

終了後、懇親会を予定しています (上野駅付近 17:45-19:45. 参加費 : 4000 円 (学生 3000 円) の予定).

参加ご希望の方は、次の申込書内容にご記入いただき、**10 月 12 日**までにメールでのご連絡をお願いいたします。

返信先： 藤垣元治 fujigaki@u-fukui.ac.jp
李 志遠 ri-shien@aist.go.jp

=====
第 4 回サンプリングモアレ法による構造物の計測技術研究会に参加します。

氏 名 :

所 属 :

E-mail :

参加費 (○印で選択してください) :

・一般 (2000 円) ・主催または後援団体所属 (1000 円) ・学生 (無料)

懇親会 : 参加 / 不参加

=====

※ 当日のご参加も受付いたします。



全空間画像計測コンソーシアム
Whole-space Measurement and Inspection Consortium